高い電荷移動相互作用を有するポリイミド薄膜における 光電導特性の面外・面内異方性と分子配向との相関

(東工大・物質応化) ○高月かほり・武政 千晶・浅井 茂雄・石毛 亮平・安藤 慎治

【要 旨】ジフェニルベンジジン骨格を有するジアミン BBMDA とフッ素置換基を導入 した酸無水物から合成されるポリイミド (PI) 薄膜は,BBMDA の強い電子供与性とフ ッ素の強い電子受容性により分子内および分子間の電荷移動性 (CT 性) が強化され, 優れた光電導特性を発現することが報告されている¹.本研究では,この PI 薄膜を対象 として面外・面内方向の光電流測定および照射光強度依存測定を行い,光電導特性の異 方性と電荷の再結合機構について PI 鎖の面内配向性との相関を検討した.その結果, 一般の π 共役系高分子とは異なり,電荷担体 (キャリア)が分子鎖間方向に優先的に輸 送され,面内配向性の増大に伴って面外方向の光電導特性が向上することが明らかとな った.また,キャリアの輸送効率向上に伴って電荷密度が増大する結果,電荷の再結合 が促進されることが明らかとなった.

【緒 言】優れた耐熱性や機械的強度を有する芳香族 PI は,絶縁体である一方,電子求 引性の酸無水物と電子供与性のジアミンの繰り返し単位からなるドナー・アクセプター 型高分子と見なすことができ,電荷移動 (CT) 相互作用の強化によって光照射下で高い 導電性を示すことが報告されている^{2,3,4,5}. 高い絶縁性を有する PI に光電導特性を付与 することで,光照射時と光非照射時の電導度に大きな差を持つ材料が得られ,将来の多 値化メモリや光スイッチなど広い分野への応用が期待される.

PIの光電導機構は次のように理解されている.PIは光照射下で電子供与性を有する ジアミンの HOMO から電子求引性の酸無水物の LUMO へ CT 遷移が起こり、ラジカル イオン対を生成する.そこへ外部電圧が印加されることで、ラジカルイオン対が電荷分 離し正孔や電子からなるキャリアが生成し、電場方向に電流が流れる.当研究室ではこ

れまでに電子供与性の強いジフェニルベンジ ジン骨格を有するジアミンからなる PI が高 い光電導特性を発現することを見出し³,その 光電導機構について検討してきた.その結果, 光電導特性の向上には,CT 相互作用の強化, 凝集状態の制御,高い分子配向性が重要であ ることを報告している^{23,45}.

本研究では、電子供与性の強いジフェニル ベンジジン骨格を有するジアミン、およびフ ッ素置換基の導入により電子求引性が強化さ れた酸無水物を組み合わせた PI 群(Fig. 1) について、面外方向と面内方向の光電流測定





と照射光強度依存測定を通じ、その光電導特性と電荷の再結合機構を検討した.

96

【実 験】Fig.1に示す酸二無水物とジア ミンを等モル量ずつ DMAc に溶解し, 撹 拌することで得られたポリアミド酸溶液 を基板上にスピンコートし、真空雰囲気 下にて 25℃で 30 分, 70℃ で 30 分間の乾 燥を行った後、一定速度で昇温し300℃で 90分の熱処理することで、PI 薄膜を作製 した. 面外方向の電流測定には ITO 基板 上に製膜した PI 薄膜上に点状の銀電極を 蒸着した試料を、面内方向の電流測定に は ITO 櫛型パターン基板上に PI 薄膜を 製膜した試料を使用した. Fig.2 に光電流 測定に用いた測定装置の模式図を示す. 窒素雰囲気のシールドボックス内で ITO 電極に正電圧を印加しつつ,キセノン光 源から分光した紫外~可視光を ITO 電極 の下面から照射し発生した電流を微小電 流計 (ADC 8340A) により計測した. ま た、ITO パターン基板の ITO 塗布部の膜 厚は約150nm であり, 吸光度から算出さ れる短波長域における光の侵入深さはど の PI においても 1 µm 未満であったこと から, 電圧印加領域全体に光が照射され





ていると考えられる.一方,面外方向の測定では膜厚方向に電圧が印加されるため,膜 厚が約 0.5 μm の試料を作製し,面内方向の計測と同様に電圧印加領域全体にわたって 光が照射されている条件で比較した.ここで,各波長に対して3分間の光照射時とその 前の3分間の暗状態において各々計測された電流値の差を光電流値と定義した(Fig.3 参照).各測定の間に3分間の放電(接地)を行うため,一波長につき計12分間の測 定時間を要する.また,照射光強度を390 nmの波長において 0.25,0.5,1,1.5,2 mW となるように光量を調節し,低照射光強度側から順に光電流を測定することで各波長に おける光電流の照射光強度依存性を評価した.加えて,面外方向と分子鎖軸がなす角度 をθとし下記(1)式で定義される面内配向性の指標 P200 を,プリズムカプラー法(Metricon PC-2010)を用いた面内外の複屈折率測定に基づいて評価した.

$$P_{200} = \frac{1}{2} (3(\cos^2 \theta) - 1)$$
(1)

【結果と考察】各 PI 膜の UV-Vis 吸収スペクトルを Fig. 4 に示す.いずれの PI でも長 波長域まで裾をひく吸収帯が観測され,強い CT 遷移の存在が確認された. CT 相互作 用の強さを表す指標に電子親和力があるが,P2FDA は,P6FDA と比較して電子親和力 が小さく分子間 CT 相互作用が弱いにもかかわらず,長波長域の吸光度は高い値を示した.これは P6FDA が嵩高い-CF3 基を 2 つ有する一方,P2FDA は嵩高い置換基を持たな いため,P2FDA-PI は P6FDA-PI と比較してより分子鎖が密に凝集し,より強い分子間 CT 相互作用が生じたと考えられる.そのため分子内のみならず,分子間 CT 遷移が光

97

吸収に強く寄与し, 電子親和力から予想さ れる程度よりも大きな CT 吸収を示したと 考えられる. すなわち, UV-vis 吸収スペク トルで得られた結果を考慮すると、分子内 と分子間の CT 相互作用の和の順列は P2FDA-PI > P6FDA-PI > P3FDA-PI > PMDA-PI>10FEDA-PI と考えられる.次 に, Fig. 5 に面外方向および面内方向の光 電流スペクトルを示す. 面外・面内方向の いずれの PI 膜試料でも, 吸光度の高い短 波長域で高い光電流値を示した.これは, 吸光度の増加とともに励起されるキャリ ア量が増加するためである.しかし,400 nm 以下の短波長域においては電流値が減 少する傾向が見られた. これは励起キャリ アが飽和し、キャリア間の再結合が惹起さ れたためと考えられる. また, 全ての PI で 面外方向と比較して面内方向の光電流値 が大きな値となった.この事実は、PIでは 面外方向に優先的にキャリアが輸送され ることを示している. さらに, 面外方向の 光電流値(j」)を面内方向の光電流値(j//) で除した値を光電導性の異方性 (η) と定義 し、面内配向係数 P200 との相関を比較した ところ(Fig. 6), 面内配向性が高い PI ほ ど高い光電流値の異方性を示したから, PI におけるキャリアの輸送が分子間方向に 効率的であることが改めて示された.次 に, 面内方向と面外方向について 420 nm で 得られた光電流値の順列を比較すると,面 外方向の光電流値は P3FDA-PI を除き,前 述した分子間 CT 相互作用の順列と同様の 結果を示した.また,面内方向の光電流値 は, 分子内 CT 相互作用を考慮した電子親 和力の順列と相関が見られ、また 10FEDA-PI が高い光電流値を示した. この PI は他 の PI に比して酸無水物部分の構造が立体 的なため面内配向性が低く,等方的な分子 鎖配向を示すことから, 面内と面外の光電 流値が近い値となり,結果として面内方向 に高い光電流値を示したと考えられる.以 上の結果から、PI 中のキャリアは分子鎖間 方向に優先的に輸送され,その光電導特性



Fig. 6 Relationships between out-ofplane/in-plane photocurrent anisotropy of PI films, η , measured at 420 nm and orientation function P_{200} .

が分子間 CT 相互作用によって強化されることが明らかとなった.次に,キャ リアの再結合について詳細に検討する ため,面外方向,面内方向ともに光電流 の照射光強度依存性を調査した.Fig.7に PMDA-PI の照射光子数と光電流値の両 対数プロットを示す.一般に,電流値 *j* と照射光強度 *I* の間には以下の関係式 (2) が成立することが知られている³.

$$j \propto I^b$$
 (2)

ここで、指数 b は電荷の再結合効率を示 す指標である. Fig. 7 の横軸は $E = c \cdot h/\lambda$ に基づいて,照射光強度を光子数に換算 した値であり,プロットの傾きから指数 b が評価される.ここで,E は照射光強 度を表すエネルギー,c は光の速度,hは プランク定数, λ は波長を示す.各 PI 膜 の面内方向および面外方向に対して得 られた指数 b b Fig. 8 に示す.指数 b が 0.5 に近い場合は光励起により発生した キャリア間の再結合(二分子反応)の寄



of irradiated photons.



Fig. 8 Out-of-plane (1) and In-plane (1/) power number **b** of PI film.

与が大きく、一方、1.0 に近い場合はキャリア間の再結合によらない失活(一分子反応) の寄与が大きい.指数 b は P3FDA-PI を除いて、面外方向および面内方向で化合物間に 大きな差異は見られなかったが、面外方向および面内方向の再結合の頻度には差が見ら れた.いずれのPIも面外方向でよりキャリア間の再結合確率が大きいことが示された. 前述のとおり、面外方向はキャリアの移動度が高く、またキャリア密度が高いため、キ ャリア間の再結合が促進されたと考えられる.

【結論】PI薄膜の面外・面内方向の光電流測定および照射光強度依存測定を行い,光 電導特性の異方性およびキャリアの再結合機構について PI 鎖の面内配向性との相関を 検討した.いずれの PI でも面内方向に比べて面外方向の光電流値が大きく, PI 鎖の面 内配向性の高いポリイミドほど光電導特性の異方性が大きな値を示したことから,キャ リアの輸送が分子鎖内方向と比較して分子鎖間方向へ優先的に起こることが示され,面 内配向性の向上によって光電導特性が強化されることが明らかとなった.また,面外方 向に電圧を印加した試料において電荷間の再結合が強く認められたことから,キャリア 密度の増加によりキャリア同士の再結合が促進されることが示された.

【参考文献】

- 1. 高月かほり; 武政千晶; 安藤慎治ほか, 高分子学会予稿集, 67, 1H16 (2018)
- 2. 福地翔; 千野徹平; 安藤慎治ほか, 高分子学会予稿集, 64, 1F03 (2015)
- 3. C. Takemasa. S. Ando, et.al., Polymer. 2019, 180, 121713.
- 4. K. Takizawa., S. Ando, et.al., Polymer. 2018, 157, 122-130.
- 5. 千野徹平; 福地翔; 安藤慎治ほか, *高分子学会予稿集*, 66, 3F11 (2017).